ТЕОРИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭХО-АМПЛИТУДНОЙ ДЕФЕКТОМЕТРИИ

Развернутая модель ультразвукового поля эхо-канала

В. Ф. ДАВИДЕНКО

ИЭС им. Е. О. Патона НАНУ. 03680, г. Киев-150, ул. Боженко, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Проведено графоаналитическое исследование энергетических и геометрических свойств модели ультразвукового поля эхо-канала (УПЭК), успешное благодаря относительно простой функциональной связи между тремя безразмерными переменными. учитывающими все исходные физические величины, раздельно для сред без затухания (р. х. у) и с затуханием звука (q, u, v). Полученные математические уравнения моделей УПЭК для идеальных и реальных сред имеют параметрический характер, позволяющий решать прямую и обратную задачи дефектометрии. Впервые сделана важнейшая поправка в уравнениях УПЭК через учет диаграммы направленности поля. Введены новые единицы измерения базовых параметров амплитуды эхо-сигналов, дальности отражателей и затухания звука. Впервые применены частные производные от амплитуды эхо-сигнала по размеру эквивалентного отражателя в качестве меры чувствительности УПЭК – $\partial q/\partial v = B$, и по дальности отражателя в качестве меры ослабления УПЭК – $\partial q/\partial u = G$. Сформулировано условие точности ультразвуковой эхо-амплитудной (УЭА)-дефектометриии как максимизация чувствительностей трех родов: $\partial B_1/\partial u$, $\partial B_2/\partial v$ и $\partial B_3/\partial q$, обеспечивающая оптимальное выделение полезных эхо-сигналов, максимально точное измерение размеров эквивалентных отражателей и съем наиболее достоверных результатов дефектометрии при ручном сканировании объекта контроля. Впервые выявлена локальность чувствительностей трех родов, выражающаяся экстремальным характером изменения их величин. Выявлена взаимосвязь между дискретностью измерения базовой амплитуды эхо-сигналов и шириной огибающих трех родов чувствительностей, характеризующей погрешности операций УЭА-дефектометрии. Установлен главный измеряемый параметр УЭА-дефектометрии, аналогом которого можно считать современную временную регулировку чувствительности (ВРЧ) и обоснованы возможные разновидности АРД-диаграмм для практической УЭА-дефектометрии. Библиогр. 4, табл. 9, рис. 27.

Ключевые слова: ультразвуковое поле эхо-канала, ультразвуковая эхо-амплитудная дефектометрия, чувствительность трех родов, базовая амплитуда эхо-сигнала, базовая дальность отражателя, эквивалентный отражатель, комплексная базовая амплитуда, обобщенный размер эквивалентного отражателя

Более десяти лет назад появились первые публикации [1, 2] по УЭА-дефектометрии на основе новой теории, получивший название элементарная неволновая теория поля (ЭНТП). Главная особенность новой теории заключается в том, что под интеграл полного акустического давления на идеальный плоский диск («эквивалентный» отражатель звука) впервые введено вероятностное уравнение диаграммы направленности УЗ преобразователя. В результате получено решение интеграла амплитуды эхо-сигнала в виде параметрического уравнения УПЭК, связывающего три безразмерные переменные – функцию, аргумент и параметр, которые могут меняться местами и назначениями.

Разнообразие математических решений параметрического уравнения и их графических выражений для усиления логического восприятия моделей УПЭК представлено табл. 1–9, составленными однотипно по три из математической и графической модели в одной таблице.

Рассмотренная в данной статье теория УЭА-дефектометрии представлена в международных научных журналах [3, 4].

Физические переменные	Параметры, единицы измерения	Понятия, определения, обозначения
Площадь «эквивалент- ного» отражателя (ЭО)	Площадь, мм ²	Условный дисковый отражатель на месте реаль- ного дефекта определяет параметры эхо-сигнала (амплитуду и задержку), эквивалентные реаль- ным условиям УЭА дефектометрии, <i>S</i> ;
Амплитуда базового опорного эхо-сигнала	Полная высота экрана на <i>М</i> пикселей	Максимальная амплитуда эхо-сигнала от дна клиновидного образца, достигаемая регулиров-кой коэффициента усиления: <i>Q</i> = 1 = 0 дБ

Исходные физические величины и параметры УПЭК

© В. Ф. Давиденко, 2014

- НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

		Продолжение
Амплитуда эхо-сигнала от реального дефекта	Отрицательные децибе- лы, –дБ	Амплитуда эхо-сигнала, измеряемая по цифровому дисплею с фиксированным шагом дискретности $-\Delta D$ (дБ) по формуле: $A = m\Delta D$ (-дБ)
Дальность реального дефекта	Расстояние до центра де- фекта по лучу УПЭК, или дальность ЭО, мм	Расстояние, определяемое произведением скорости распространения ультразвука в ОК на половину задержки эхо-сигнала от реального дефекта: <i>r</i> = <i>CT</i> /2 (мм)
Коэффициент затухания ультразвука в материале объекта контроля (ОК)	Обратная величина ба- зовой дальности пробе- га звукового импульса L ₆ , 1/мм	В качестве базовой дальности пробега эхо-сигнала принята дальность ЭО, на которой амплитуда эхо-сигнала ослабевает на 2123 (–дБ), откуда коэффициент затухания определяется как $\delta = 1/L_6$ (1/мм)
Длина УЗ в материале ОК	Расстояние, мм	Путь пробега волны за период колебаний излучателя звука, равный $\lambda = C/f$ (мм)
Размер пьезоэлемента	Диаметр, мм	Предпочтительным при использовании по- перечных волн считаются величины $df \approx \approx 2430 \text{ мм} \cdot \text{М} \Gamma$ ц, $f = 25 \text{ M} \Gamma$ ц, откуда $d = 612 \text{ мм}$

Безразмерные переменные для математического описания УПЭК

Формулы перехода от размерных величин	Понятия, определения			
к безразмерным				
В среде без затухания звука				
$p = A/Q = m/M = 1,222^{-D}$	Базовая относительная амплитуда эхо-сигнала			
$x = r\lambda/d^2 = r/n\lambda = r/L_{\rm up}$	Относительная дальность ЭО			
$y = \sqrt{S} / d$	Относительная величина ЭО			
$L_{\rm np} = n\lambda$	Предельная дальность УПЭК, мм			
В реальных средах				
$q = ngp = 1,122^{-D}$	Базовая относительная амплитуда эхо-сигнала			
$u = ngx = \delta r = r/L_6$	Базовая относительная дальность ЭО			
$v = ngy = \delta\sqrt{nS} = \sqrt{nS} / L_{6}$	Масштабный размер ЭО			
$z = v / u = y / x = d\sqrt{S} / \lambda r = \sqrt{nS} / r$	Обобщенный комплексный параметр ЭО			

Новые безразмерные параметры УПЭК

Параметры УПЭК	Понятия, определения
$n = d^2/\lambda^2$	Динамический диапазон активной площади преобразователя
$g = \delta \lambda = \lambda / L_{\delta}$	Удельное затухание звука или затухание на длине одной волны
$ng = n\lambda/L_6 = L_m/L_6$	Доля ослабления УПЭК в идеальной среде от базового затухания
un u	2123 (-дБ/1) (масштаб ослабления УПЭК)
$q = 10^{-D/20} = e^{-D/8.686} = 1,122^{-D}$	Связи между относительной мерой амплитуды эхо-сигналов и деци-
	бельной мерой D (-дБ) (тождественные выражения связи);
$G = \partial q / \partial u$	Ослабление базовой амплитуды эхо-сигналов, вызванное увеличени-
	ем дальности отражателей (ослабление УПЭК)
$B = \partial q / \partial v$	Прирост базовой амплитуды эхо-сигналов, вызванный приростом раз-
	меров ЭО (чувствительность УПЭК)

Промежуточный вывод: пять исходных физических переменных и два параметра заменены двумя совокупностями по три безразмерных переменных для идеальной и реальной сред.

Построение физико-математической модели УПЭК

Вероятностная модель диаграммы направленности поля

Круглый преобразователь с площадью $S_0 = \pi d^2/4$ разбит на элементарные излучатели площадью $\lambda^2/4$, количество которых равно $\pi d^2/\lambda^2 = \pi n$. Каждый такой излучатель имеет круговую диаграмму направленности $\Phi(\phi) = \cos \phi$. Поэтому излучение зондирующих импульсов и прием эхо-сигналов в УПЭК описаны как плотности вероятностей событий, состоящих в совместном излучении–приеме сигналов от πn независимых источников в разных направлениях. Распределение этих плотностей вероятности интерпретированы как ДН преобразователя в режиме излучения–приема:

$$\Phi^{2}(\varphi) = (\cos\varphi)^{2\pi n} = (1 + tg^{2}\varphi)^{-\pi n} = (1 + a^{2}/r^{2})^{-\pi n} =$$

= $(1 + nS/\pi nr)^{-\pi n} \approx \exp(-nS/r^{2}) =$ (1)
= $\exp(-v^{2}/x^{2}) = \exp(-v^{2}/u^{2}).$

При условии, что $\pi n \ge 10^2$, ошибка замены функций не более 0,1 %.



=[$2J_1(X)/X$]², 3 – $\Phi^2(\varphi) = \exp(-nS / r^2) = \exp(-y^2/x^2)$ при $X = (kd)\sin\varphi = (\pi d/\lambda)\sin\varphi$, где $k = 2\pi/\lambda$ – волновое число.

Амплитудно-размерная модель УПЭК в идеальной среде

Таблица 1



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ



Модель чувствительности УПЭК в идеальной среде

Особенности распределения чувствительностей УПЭК по трем независимым переменным



Математические модели	Графические модели	
Чувствительность УПЭК к размерам ЭО (основное понятие): $\partial p/\partial y = B =$ =2(y/x)exp (-y ² /x ²). (7) Изменение чувствительности УПЭК 1-го рода от дальности: $\partial B_1/\partial x = -2(z/x)(1-2z^2)\exp(-z^2).$ Максимум $\partial B_1/\partial x$ соответствует оптимальному значению: $z_{opt} = y / x = \sqrt{nS} / r = \sqrt{0,5}$. (8)	Рис. 5. Распределение чувствительности УПЭК 1-го рода по дальности отражателей	
Изменение чувствительности УПЭК 2-го рода от размеров ЭО для их разных дальностей: $\partial B_2/\partial y = 2(y/x)\exp(-y^2/x^2)$. (9) Условие максимума чувствительно- сти УПЭК 2-го рода к размерам ЭО: $\partial B_2/\partial y = (2/x)(1-2z^2)\exp(-z^2) = 0$ соответствует оптимальному значе- нию: $z_{opt} = y / x = \sqrt{nS} / r = \sqrt{0,5}$.	Puc. 6. Распределение чувствительности УПЭК 2-го рода по размерам ЭО	
Чувствительность УПЭК 3-го рода к размерам ЭО для базовых амплитуд эхо-сигналов: $\partial B_3 / \partial p =$ (10) $= (1 - p / x) \sqrt{-\ln(1 - p / x)}$. Условие максимума чувствите- льности УПЭК 3-го рода к базовым амплитудам эхо-сигналов: $\partial B_3 / \partial p = -2\ln(1 - p/x) - 1 = 0$, что соответствует оптимальному значению: $p_{opt} = P/Qx = 0,394$. (11)	В ₁ 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 Рис. 7. Распределение чувствительности УПЭК 3-го рода по амплитудам базовых эхо-сигналов	

人 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ—

Развернутая модель УПЭК в реальной среде

Амплитудная (энергетическая) модель УПЭК

Таблица З



Геометрическая модель УПЭК в реальной среде

Таблица 4



Рис. 11. Размерная физико-математическая модель УПЭК в реальной среде



Структура ближней зоны УПЭК исследуется через производную $\partial q/\partial u = 0$ с помощью уравнения (14), рассмотренного далее.

Пределы по дальности для каждой равносигнальной линии УПЭК для заданного уровня *q* определяются из условия:

$$qe^{2u-1} = 2u.$$
 (19)

Это уравнение решается наложением прямой $y_1 = 2u$ и кривых:

 $y_2 = 1 - \ln(q/2u),$ (20) представленных на рис. 13, где сверху вниз:

q = 0, 1; 0, 5; 1, 0.

Таблица 5

С помощью рис. 11 и 13 строится геометрическая граница УПЭК откладыванием на равносигнальных линиях рис. 11 их пределов по дальности, взятых из рис. 13.







Рис. 13. Пределы по дальности равносигнальных силовых линий УПЭК

Графоаналитические решения уравнений (14) и (16)

Математические модели Графические модели Уравнение (14) решается графоаналитическим разбиениdqем на два уравнения: $y_1 = 0, 5 - u,$ $y_2 = z/(e^z - 1),$ (21, a)(21. *б*) где уравнение (21, б) заменяется семейством простых линейных уравнений при v = const (рис. 14): $y_3 = 1,15u/v - 100$ -0,5, исходящих из точки (0; -0,5). Сравнение уравнений (21, а) и (21, б) дает решение в виде 1,15u/v = 1-u. (22)Отсюда безразмерная длина ближней зоны u = v/(1, 15 + v);(23)размерная длина ближней зоны $r_6 = (1,15 / \sqrt{nS} + \delta)^{-1}$. (24) Условие максимума чувствительности УПЭК (16) преобразуется в уравнение: $\sqrt{nS} = r_{opt} \sqrt{\delta r_{opt}} + 0.5$, (25) Баловая относительног дальность ЭО » Рис. 14. Графическая схема решения уравнения (14) r_{opt}, MM 80 связывающее между собой обобщенный размер ЭО с оптимальной дальностью при известных начальных 60 условиях: параметре преобразователя $n = d^2/\lambda^2$ и 40 коэффициенте затухания звука б в материале ОК. 20Непрямое уравнение (25) графически строится в виде номограммы (рис. 15), которая, при экспериментальном û 40 60 80 100 Обобщенный размер ЭО √лS. мм выделении максимальной амплитуды эхо-сигнала от ЭО используется для определения коэффициентов затухания Рис. 15. Номограмма для экспериментального звука в точке пересечения координат обобщенного размера определения коэффициентов затухания звука в УПЭК ЭО и оптимальной дальности.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ-

Модели локальной чувствительности УПЭК

Таблица б



Модели ослабления локальных максимумов чувствительности УПЭК 3-х родов



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ, №4, 2014





 $B_{2\text{max}} = 4,67e^{-2,83\nu}$. (37) Ослабление максимумов чувствительности УПЭК 2-го рода:

$$\partial (\ln B_{2max}) / \partial v = G_2 = 24,58 - \mu E/1.$$
 (38)

Градиент ослабления (затухания) чувствительности УПЭК 2-го рода G_2 – постоянная величина (линия A на рис. 20).

Локальные максимумы чувствительности УПЭК 3-го рода для комплексных базовых амплитуд на разных дальностях при $q_{kmax} = 0,394$:

$$B_{3\max} = 4e^{1-2u}(1-q_k) \times \sqrt{-ln(1-q_k)} = 4,66e^{-2u}.$$

Ослабление максимумов чувствительности УПЭК 3-го рода:

$$\partial(B_{3\max})/\partial u = G_3 = 17,38, -дБ/1.$$



Рис. 20. Ослабление локальных максимумов чувствительности УПЭК 2-го рода



сти УПЭК 3-го рода

Комплексные чувствительности УПЭК 3-х родов для решения трех основных задач дефектометрии

(39)

Таблица 8



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ, №4, 2014

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ-

Таблица 9.

Развитие видов АРД-диаграмм

Математические молели Графические модели D Теоретическая АРД-диаграмма (номограмма): $D = 17,37 \{1 + \ln u - 2u +$ 8 $+ \ln[1 - \exp(-v^2/u^2)]$ (- πE). (40)-12Равноразмерные линии диаграммы в диапазонах: -18 $0.6 \le v \le 1.2$ и $1 \le u \le 2.5$ в логарифмическом -24масштабе имеют незначительную кривизну, что -30 позволяет аппроксимировать их наклонными -36 прямыми: -42 $D = 12 - \gamma T (-дБ),$ 48 0.5 1.0 1.5 2.0 Базовая относительная дальность ЭО и где γ – коэффициент затухания, дБ/мкс. Рис. 25. Теоретическая АРД-диаграмма (номограмма) D_{κ} Экспериментально-теоретическая АРД-диаграмма по уравнению: $1 - \exp(-v^2/u^2) = q e^{2u-1}/2u = q_{\mu}$ (41)Левая сторона уравнения – теоретическая (-дБ). Правая сторона рассчитывается как комплексная -16 базовая амплитуда D_{ι} (-дБ) с дальностью и в -24 заштрихованной области АРД-диаграммы при условиях: -32 $q_{_{\rm B}} = 1,1ue^{-2u}$ и $q_{_{\rm H}} = 3,3ue^{-2u}$ для чувствительности УПЭК 3-го рода на уровне 0,9. 0.4 0.8 1.2 1.6 Базовая относительная дальность ЭО и Рис. 26. Экспериментально-теоретическая АРД-диаграмма Универсальная АРД-диаграмма в виде прямо-угольной сетки, в пределах которой решается обратная 0.3max залача УЗК: 0.8 $v = u \sqrt{-\ln(1-q_k)} ,$ (42)0.6где $q_{\nu} = 1,122^{-D}e^{2u-1}/2u$ с линейно-графическим преобразованием в семейство наклонных прямых 0.4в границах УПЭК. Между прямыми $q_{\mu} = 0,2$ и $q_{\mu} = 0,6$ – область чув-0.2ствительности УПЭК 3-го рода на уровне 0,9 (заmin штрихована на рис. 27). Уравнение границы УПЭК с приведенной чув-0 1.0 Базовая относительная дальность ЭО и

ствительностью C = 0.5Рис. 27. Универсальная АРД-диаграмма в виде прямоуголь-

 $v = u \sqrt{-\ln(Cu)}$. (43) ной сетки v – u

Выводы

Математическая модель УПЭК построена на основе законов лучевой акустики тракта, вероятностной обратимой модели диаграммы направленности преобразователя и идеальной модели «эквивалентного» отражателя (ЭО).

Шесть безразмерных переменных, адекватно описывающих модель УПЭК, разделены для сред без затухания и для сред с затуханием звука, между которыми установлена связь через коэффициент ng, выражающий масштаб ослабления УПЭК в реальной среде по сравнению с идеальной средой.

Установлено, что ослабление УПЭК от дальности отражателей в идеальной среде составляет 1,5...2,0 –дБ/1, а в реальной среде ослабление звука на базовой единице дальности составляет 21...23 –дБ/1, т. е. на \approx 20 –дБ сильнее из-за совместного влияния расширения фронта импульса

и затухания звука. Исследована динамика чувствительности УПЭК, которая зависит не только от величины переменных, но и от характера взаимосвязи между ними, которая формирует локальные колоколообразные формы огибающих чувствительностей УПЭК 3-х родов с постоянными максимумами в идеальной среде и с ослабевающими максимумами в реальной среде.

- НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Ширины локальных колоколообразных форм огибающих чувствительностей УПЭК 3-х родов на фиксированных уровнях от их максимумов при данной дискретности измерения амплитуды эхо-сигналов используются для оценки погрешностей выделения, измерения и снятия размеров эквивалентных отражателей.

Установлен основной измеряемый параметр УЭА-дефектометрии в виде комплексной базовой амплитуды эхо-сигналов (аналог современной временной регулировки чувствительности), имеющей оптимальное значение $q_{kopt} \approx 0,4$ для максимальной чувствительности УПЭК 3-го рода.

В целом предложенная теория УПЭК себя не исчерпала и может быть продолжена в других

практических направлениях УЭА-дефектометрии на основе дальнейшего физико-математического анализа исходных моделей.

- 1. Давиденко В. Ф. Об элементарной неволновой теории поля ультразвуковых преобразователей для ипульсно-амплитудной дефектометрии // Техн. диагностика и неразруш. контроль. -2010. № 3. С. 29-36.
- 2. Давиденко В.Ф. Новые представления о чувствительности поля – новые возможности повышения точности ультразвуковой эхо-амплитудной дефектометрии // Там же. – 2011. – № 3. – С. 28–34.
- 3. *Davidenko V. F.* The metrologic fundamentals of Ultrasonic Echo-Amplitude (UEA) defectometry // Int. J. Microstructure and Properties. 2013. **8**, № 3. P. 207–224.
- Davidenko V. F. Principles of elenentary non-wave theory of field of ultrasonic transducers used for pulse-amplitude defectometry // Int. J. Materials and Product Technology. – 2006. – 27, № 3/4. – P. 173–187.

Graphic-analytical study of energy and geometrical properties of the model of ultrasonic field of echo-channel (UFEC) has been performed, which was successful owing to a relatively simple functional link between three dimensionless variables, allowing for all the initial physical quantities (p, x, y), separately for media with and without sound attenuation (q, u, y). Derived mathematical equations of UFEC models for ideal and real media are of parametric nature, allowing solution of the direct and inverse problems of defectometry. A most important correction in UFEC equations, allowing for field directional pattern was made for the first time. New units for measurement of base parameters of echo-signal amplitude, reflector distance and sound attenuation were introduced. Partial derivatives of echo-signal amplitude by the equivalent reflector size were used for the first time as the measure of UFEC sensitivity $-\partial q/\partial v = B$, and by the distance to reflector as a measure of UFEC attenuation - $\partial q/\partial u = G$. Condition of accuracy of ultrasonic echo-amplitude (UEA)-defectometry was defined as maximizing the sensitivity of three kinds: $\partial B_1/\partial u$, $\partial B_2/\partial v$ and $\partial B_2/\partial q$, ensuring optimum separation of useful echo-signals, maximum accurate measurement of dimensions of equivalent reflectors and taking the most valid results of defectometry at manual scanning of the object of control. Local sensitivity of three kinds was detected for the first time, which is expressed in the extreme nature of change of their values. An interrelation was established between the discreteness of measurement of basic amplitude of echo-signals and width of envelopes of three kinds of sensitivities, characterizing UEA-defectometry operation errors. The main measured parameter of UEA-defectometry was established, the analog of which can be regarded to be modern time adjustment of sensitivity; and possible variants of ADD diagrams for practical UEA-defectometry were substantiated. 4 References, 9 Tables, 27 Figures.

K e y w o r d s: ultrasonic field of echo-channel, ultrasonic echo-amplitude defectometry, sensitivity of three kinds, basic amplitude of echo-signal, basic distance to reflector, equivalent reflector, complex basic amplitude, generalized size of equivalent reflector

Поступила в редакцию 03.02.2014

НОВАЯ КНИГА

Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона: 80 років / Ред. кол. Б. Є. Патон (голова) та ін. – К.: Академперіодика, 2014. – 400 с.

В сборнике представлены научно-информационные материалы, посвященные основным направлениям развития научно-технической и производственной деятельности Института электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины на протяжении 80 лет его существования. Освещены основные вехи создания, становления и развития института. Отображены научные достижения в области сварки и родственных технологий, сотрудничество с промышленными предприятиями, международная деятельность. Представлена современная структура института и основные направления исследований и их внедрение в производство.

Рассчитан на широкий круг ученых, преподавателей, аспирантов, студентов вузов, а также исследователей истории развития технических наук.

